

# TEKNOKESKIVIIKKO

25.5.2011 klo 13.00-16.00

Paikka: Teknologiaakeskus KETEK Oy, Korpintie 8 Kokkola

## *Materiaalitutkimuksen laitteet ja sovellukset*

Brukerilla on laaja valikoima eri tekniikoihin perustuvia materiaalien tutkimuslaitteita. Tämän kertaisessa teknokeskiviikossa käydään läpi mm. atomivoimamikroskopian, elektronimikroskopian, alkuaineanalyysointilaitteiden ja optisen profiilometrian soveltuvuutta alueemme teollisuudelle. Tilaisuuden painopisteinä ovat erityisesti nanomittakaavan mittaukset sekä menetelmien soveltuvuus polymeerien analysointiin. Tilaisuus on englanninkielinen.

13.00	Welcome	Pekka Oinas
13.05	Introduction to Bruker AXS Nordic	Mats Eriksson
13.20	High throughput nanoscale materials characterisation using <b>AFM</b>	Ian Armstrong
13.50	Non contact 3D materials and device inspection using Wyko Contour <b>Optical Profilers</b>	Ian Armstrong
14.20	<b>Coffee Break</b>	
14.40	High resolution low voltage <b>FE-SEM</b> imaging of polymeric structures and nanocomposites	Julia Netrval
15.10	X-ray microanalysis ( <b>EDS</b> and <b>EBS</b> ) combining high speed and accuracy	Mats Eriksson

*Lisätietoja:*

FT Hanna-Kaisa Koponen  
Nanoteknologian osaamisklusteri  
044 7250 270

TkT Leena Favén  
Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri  
044 7250 273

***Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!***

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 23.5.2011 mennessä, Mia Kronqvist,  
[mia.kronqvist@ketek.fi](mailto:mia.kronqvist@ketek.fi); 044 7250 202